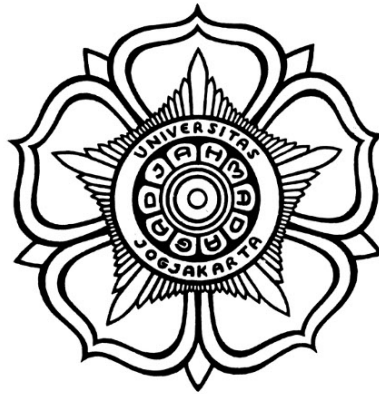


TESIS

KAJIAN SPEKTROSKOPI ELLIPSOMETRI PENGARUH SUBSTRAT TERHADAP KONSTANTA DIELEKTRIK LAPISAN TIPIS BISMUTH PADA PANJANG GELOMBANG 220-850 nm

(SPECTROSCOPIC ELLIPSOMETRY STUDY OF THE INFLUENCE OF SUBSTRATE ON THE DIELECTRIC CONSTANT OF BISMUTH THIN FILM AT WAVELENGTH 220-850 nm)



I KETUT AGUS PUTRA DANA
17/418513/PPA/05297

PROGRAM STUDI S2 FISIKA
DEPARTEMEN FISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA

2019